



## 师资力量

### 冯建华

院士介绍
<b>人员构成</b>



职称：副教授

研究所：微纳电子学研究院

研究领域：IC设计和测试、硬件安全

办公电话：86-10-62767302

电子邮件：fengjh@pku.edu.cn

#### 科研/教育经历

冯建华，男，博士，北京大学副教授。分别于1986年7月、1995年3月和2000年4月在哈尔滨工业大学、西安电子科技大学和西安微电子技术研究所获学士、硕士和博士学位。1986年8月至2000年4月在西安微电子技术研究所工作，2000年5月至2002年4月在清华大学微电子学研究所做博士后工作，2002年5月至今在北京大学微纳电子学研究院工作。主要研究领域包括IC设计和测试、芯片安全、可靠性加固与预警等。

#### 研究成果概况

主要科研项目包括国家自然科学基金4项、国家预研项目3项（基于嵌入式内核SOC 系统芯片测试方法研究、嵌入式模拟和混合信号电路DFT 和BIST 研究、芯片硬件木马安全检测方法研究、硬件木马检测方法和可信设计技术研究、现场可编程门阵列器件可测试性设计和测试技术等）。讲授“VLSI测试和可测试性设计”和“模拟、混合信号和射频电路测试”课程。曾获省部级一、二等奖2项，出版著（译）作3部，授权专利8项，发表论文40多篇，主持开发了40多种集成电路验证和测试程序。电子学会和计算机学会高级会员，容错专委会常委。

[网站首页](#) [关于本院](#)

[研究中心](#) [实验室](#)

[师资力量](#) [教学教务](#)



[科学研究](#) [合作交流](#)

[党建生活](#) [新闻通知](#)

[招生招聘](#) [信息服务](#)

版权所有©北京大学

地址: 北京海淀颐和园路5号

邮编: 100871

电话: 010-62756141

邮箱: netgroup@gse.pku.edu.cn

